弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル

【特許】＜充足論＞

数値限定発明（3）数値範囲を僅かに外れる場合の充足論

①有効桁数・②製造誤差

数値限定発明(3)数値範囲を僅かに外れる場合の充足論

①有効桁数・②製造誤差

【特許】【意匠】【知財全般】

弁護士・弁理士・米国CAL弁護士

米国PA試験合格

高石秀樹

①「有効数字」に基づく四捨五入の主張

東京地判平成12年（ワ）19360「水管式ボイラ」事件⇒充足論△

「1．1≦P／D≦2．0」という数値範囲について、「2．02322は，有効数字で算定した場合に，2．0をほぼ充足すると解することもできなくない」としたものの、他の要件が非充足であるから結論に影響がないとされた。（リップサービス？）

大阪地判平成14年（ワ）10511「酸素発生陽極」事件⇒充足論×

⇒クレームアップされた数値は有効数字1桁であったが、実施例の測定結果は少なくとも2桁であったことを考慮して、有効数字1桁での四捨五入を否定した。同事案では、均等論も否定された。

※このように、裁判所は、有効桁数に基づく四捨五入により数値範囲に属するという主張を、一般論として否定はしていない。もっとも、非充足の結論が出ている事案における、単なるリップサービスに過ぎないのではないかとも思われ、これらの裁判例に依拠することは危険である。

※対象製品が特許発明の数値範囲を僅かに外れる場合に均等論が認められた裁判例は、米国では存在するが、日本では存在しない。
In U.S. Philips Corp. v. Iwasaki Electric Co. (Fed. Cir. Nov. 2, 2007)

②「製造誤差」の主張

前掲・大阪地判平成14年（ワ）10511「酸素発生陽極」事件

⇒特許請求の範囲は3.0μmが上限であるが、実施例において想定されている誤差の範囲（0.5μm）を考慮すれば3.5μm未満であれば発明の技術的範囲に属する旨の特許権者の主張も斥けた。**⇒充足論×**

東京高判昭和62年（ネ）1010「可変漸進集束力を有する光学レンズ」事件

「発明の構成要件が，・・・寸法等の数値を含むとき，その**数値は設計値であり，かつ，その数値が当該発明の構成要件である。**一定の製造上の誤差が予測されるとしても，そのこと故に，構成要件であるその数値がその誤差の分だけ広くなったり狭くなったりするものではない。」**⇒充足論×**

⇒クレームされた数値範囲（0.5mm）に製造誤差（±1.0mm）を考慮した値（2.5mm）まで技術的範囲に含まれるという特許権者の主張を斥けた。

関連論点～引用発明の認定における有効桁数

平成14年（行ケ）第213号「マイクロバブル」事件

⇒公然実施品の測定結果「1.18」が、有効数字を2桁で「1.2」であるから、数値範囲「1.2～3.0」の発明は新規性が無いと判断した。

　同判決は、同数値は3つの要素の和であるところ、公然実施品の計算根拠となるデータは有効数字3桁のものと2桁のものが混在していたからそれらの和の有効数字は2桁であると論じているから、前掲・大阪地判平成14年（ワ）10511（「酸素発生陽極」事件）と矛盾しない。

（まとめ／TIP） ※裁判例に基づく過激な提言

①有効桁数に基づく四捨五入も、②製造誤差も、特許権者勝訴判決がない。
⇒実施例の有効桁数、実施例が許容する製造誤差を考慮して、出願当初から特許請求の範囲の数値範囲を広げておくことも一考である。例えば、実施例の上限・下限が其々3.0、1.2であり、実施例の有効桁数が2桁であった場合なら、「1.15~3.04」という数値範囲をクレームアップしておく。同様に、製造誤差が0.1であれば、「1.1~3.1」という数値範囲をクレームアップしておくという発想である。

この発想は、前掲・大阪地判平成14年（ワ）10511（「酸素発生陽極」事件）の「実施例において、0.5ミクロンの誤差があるのであれば、その誤差の範囲まで、すなわち、『3.5ミクロン未満』を上限として特許請求の範囲に記載すればよいのである。ところが、これをせずにおいて、特許請求の範囲に上限を『3ミクロン』と記載しておきながら、『 3.5ミクロン未満』が技術的範囲であるとすることは、特許請求の範囲の記載の明確性を損なうものである。」という判示と合致する。
（⇒記載要件の問題は、裁判例が存在しないため、今後の検討課題である。）